(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-320538

(43)公開日 平成7年(1995)12月8日

(51) Int.Cl. ⁶ H 0 1 B 3/00 B 3 2 B 15/08 H 0 5 K 1/08	J	FΙ	技術表示箇所
		審査請求	未請求 請求項の数5 OL (全 5 頁)
(21)出願番号	特顧平6-113046	(71) 出願人	000003296 電気化学工業株式会社
(22)出顧日	平成6年(1994)5月26日	(72)発明者	東京都千代田区有楽町1丁目4番1号 福田 誠 群馬県渋川市中村1135番地 電気化学工業 株式会社渋川工場内
		(72)発明者	米村 直己 群馬県渋川市中村1135番地 電気化学工業 株式会社渋川工場内
		(72)発明者	梅沢 宏之 群馬県渋川市中村1135番地 電気化学工業 株式会社渋川工場内

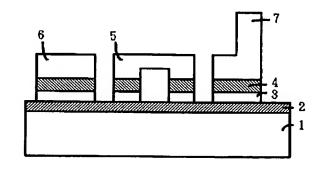
(54) 【発明の名称】 絶縁材料組成物及びそれを用いた回路基板とモジュール

(57)【要約】

【目的】 電気機器、通信機、自動車用途などの電子部品に用いられる高熱伝導性でしかも高電気絶縁性を長期に渡り維持し得る絶縁材料組成物と、これを用いた金属ベース回路基板、更にこれを用いたモジュールを提供すること。

【構成】 無機充填材と樹脂からなる混合物を硬化させてなり、その熱伝導率が3.0×10°3 cal/cm·sec·℃以上であり、しかも比誘電率が4.5以下である絶縁材料組成物を構成とする。又、この絶縁材料組成物を用いた金属ベース回路基板、更に、この金属ベース回路基板を用いたモジュールである。

【効果】 本発明の絶縁材料組成物は熱伝導率が高く、 しかも比誘電率が低いので、これを用いた金属ベース回 路基板及びモジュールは、放電開始電圧が高く長期に渡 り電気絶縁性が維持でき、信頼性が高い。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 無機充填材と樹脂からなる混合物を硬化させてなり、その熱伝導率が3.0×10°cal/cm·sec·℃以上であり、しかも比誘電率が4.5以下であることを特徴とする絶縁材料組成物。

【請求項2】 無機充填材が、窒化硼素、ダイアモンド、酸化ベリリウムのうちの1種又は2種以上を含む請求項1記載の絶縁材料組成物。

【 請求項3 】 無機充填材が、黒鉛化度(G I 値)が2. の以下の六方晶窒化硼素を含むことを特徴とする請求項 1 記載の絶縁材料組成物。

【請求項4】 金属板に請求項1、2又は3記載の絶縁 材料組成物を介して導電箔を積層してなる回路基板。

【請求項5】 請求項4記載の回路基板を用いてなるモジュール。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は電気機器、通信機、自動 車用途などの電子部品に用いられる絶縁材料組成物とこ 【0008】また、回路基板は、その使用条件下で次第 れを用いた金属ベース回路基板、更にこれを用いたモジ 20 に電気絶縁性が劣化して最終的には絶縁破壊現象を起こ ュールに関するものである。 し寿命に至ることが知られている。電気絶縁性の劣化の

[0002]

【従来の技術】金属ベース回路基板、半導体素子その他の電子、電気部品の封止材、接着剤或いはボッティング剤の用途に高熱伝導、高耐電圧の絶縁材料が要求されている。例えば、金属ベース回路基板は、ハイパワー分野に使用されるため、その基板の絶縁層には、高電気絶縁性及び高熱伝導性といった性能が要求される。更に、回路の小型化、高機能化を目的に回路の高周波化が進んでおり、比誘電率の低い回路基板及びそのための絶縁材料が望まれている。特に、近年【GBT素子等のパワー素子が搭載されるようになり、低誘電率で、高電気絶縁性を有し、しかも高熱伝導性を兼ね備えている金属ベース回路基板が要求され、その絶縁層を形成するための絶縁材料組成物が必要とされている。

【0003】金属ベース回路基板においては、酸化アルミニウム等を充填した樹脂からなる電気絶縁性の接着剤にて金属板と導電箔とを接着するが、この接着剤が硬化した絶縁材料は金属板上に絶縁層を形成している。金属ベース回路基板の諸特性は絶縁層、従って絶縁材料の特性に大きく左右されるので、いろいろな組成物が開示されてきた。

【0004】例えば、特開平2-286768号公報には、特定の粒子径の無機充填材を用いることにより、無機充填材を高充填することができ、熱伝導率が高い回路基板用絶縁接着剤組成物が得られ、その接着剤組成物を介して金属基板と導電箔とを積層し回路基板を得ていることが開示されている。

【0005】また、特開平6-44824号公報には、 4.5. 純度90%以上のビスフェノールA型エポキシ樹脂に酸化 50 る。

アルミニウム、窒化アルミニウム、窒化硼素の無機充填材を充填し、熱伝導率が5.0×10⁻³~18.0×10⁻³ cal/cm·sec·°Cであり、かつガラス転移温度が164~240℃である絶縁材料とそれを用いた回路基板が開示されている。【0006】

【発明が解決しようとする課題】しかし、酸化アルミニウム(比誘電率9.0)のような高比誘電率の物質を高充填した樹脂からなる絶縁材料に於いては、無機充填材の充填量が多くなるにつれて、絶縁材料の比誘電率が高くな10 る。またこれと同時に粘度が高くなりボイドの巻き込みが多くなるため、電気絶縁性が低下し耐電圧特性が低下するという問題があった。

【0007】一般的に、層状の絶縁材料中に存在するボイドにかかる電圧は、絶縁材料の比誘電率が高いほどボイドに高電圧が印加されるので、ボイドで放電し易くなる。このため、充填材の比誘電率が高いほど、絶縁層従ってこれを用いた回路基板の電気絶縁性は低下しやすい。

【0008】また、回路基板は、その使用条件下で次第 に電気絶縁性が劣化して最終的には絶縁破壊現象を起こ し寿命に至ることが知られている。電気絶縁性の劣化の 進み方は、その初期段階でボイド等の絶縁層内部で部分 的な放電現象を呈し、この部分的な放電が絶縁層の劣化 を促進し、ついには絶縁層を通過する放電現象を引き起 こし絶縁破壊に至る。従って、電気絶縁性の長期信頼性 を達成するには、放電開始電圧を高くすることが大切で ある。

【0009】従来の金属ベース回路基板では、高熱伝導性を重視して無機充填材として比誘電率の高い酸化アルミニウムを主に用いていた。もしくは電気絶縁性を重視して無機充填材を添加しないか、もしくは添加しても少量のみの充填にとどめていた。前者は高熱伝導性を有するが電気絶縁性が低くく長期信頼性が劣り、後者では電気絶縁性に優れるが熱伝導性が劣るので高放熱性を要求される用途には利用できなかった。このように、高熱伝導性を維持しながら、高電気絶縁性とその長期信頼性を兼備することは難しいという問題があった。

【0010】本発明の目的は、高熱伝導性で、かつ、高電気絶縁性を長期に渡り維持できる金属ベース回路基板等に用いる絶縁材料組成物を提供することにある。

【0011】また、本発明は、高出力の素子を高密度で搭載しても、熱放散性に優れ、電気絶縁性に優れ信頼性の高い回路基板及びモジュールを提供することを目的とする。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明は、無機充填材と 樹脂からなる混合物を硬化させてなり、その熱伝導率が 3.0×10⁻³ cal/cm·sec·℃以上であり、しかも比誘電率が 4.5以下であることを特徴とする絶縁材料組成物であ

【0013】又、本発明は、該無機充填材が窒化硼素、 ダイアモンド、酸化ベリリウムのうちの1種又は2種以 上を含むことを特徴とする絶縁材料組成物である。

【0014】又、本発明は、該無機充填材が黒鉛化度 (G I 値)が2.0以下の六方晶窒化硼素を含むことを特徴 とする絶縁材料組成物である。

【0015】更に、本発明は、熱伝導率が3.0×10⁻³ cal /cm·sec·℃以上であり、しかも比誘電率が4.5以下であ る絶縁材料組成物を介して導電箔を積層してなる回路基 板であり、加えて、該回路基板を用いてなるモジュール 10 である。

【0016】以下、図面により本発明を詳細に説明す る。本発明の絶縁材料組成物で絶縁層を形成してなる金 属ベース回路基板を用いたモジュールの断面図を図1に 示す。金属板1上に、本発明の絶縁材料組成物よりなる 絶縁層2を介して導電箔3が積層された金属ベース回路 基板を得た後、エッチング等の処理を施し、セラミック スチップ部品5、半導体素子6、端子7等をハンダ4を 介して積層した構成からできている。

度のアルミニウム及びアルミニウム合金、銅、鉄、ステ ンレス系合金及びインバー系多層金属等が用いられる。 【0018】絶縁層2は、無機充填材と樹脂を混合し硬 化させた絶縁材料組成物であり、熱伝導率が3.0×10⁻³c al/cm·sec· C以上でしかも比誘電率が4.5以下である。 絶縁層2の比誘電率が4.5を越えると、放電開始電圧が 極端に低下して放電劣化が生じ易くなり、回路基板の電 気絶縁性の長期信頼性が著しく損なわれる。熱伝導率に ついては、3.0×10⁻³ cal/cm·sec·℃未満であるとパワー 素子から発生する熱を効率よく放出することができず、 素子の温度がジャンクション温度(約150℃)を越え、素 子が誤動作したり寿命が短くなる。

【0019】絶縁層2を形成する絶縁材料組成物に使用 される樹脂としては、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、 BTレジン、ポリイミド樹脂等が用いられる。エポキシ*

G I 値=((100)面積+(101)面積)/((102)面積)・・・・(1)

【0024】GI値の小さいほど、結晶性が高い。完全 に結晶化が進んだ六方晶窒化硼素でG I 値は1.4とな る。本発明で用いる六方晶窒化硼素の結晶性は、2.0以 下が好ましいが、より好ましくは1.6以下である。黒鉛 化度が2.0を越える六方晶窒化硼素は、一般的に純度が 低く、樹脂との混合時にガスを発生してボイドを巻き込 み易く耐電気絶縁性が低い、もしくは熱伝導性が低いと いう問題が発生する。

【0025】前記の窒化硼素は、樹脂と窒化硼素の界面 の接着性を髙めるために、シリコーンカップリング剤、 チタネートカップリング剤、シリル化剤等にて表面処理 を施したものが良い。これらのうち有機シラン化合物で 表面処理を施したものがより好ましい。また、表面処理 剤による窒化硼素の表面処理は、樹脂と窒化硼素の混合 50 以上含む合金又は前記金属を使用したクラッド箔等の汎

* 樹脂としては、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビス フェノールト型エポキシ樹脂が低粘度であり、無機充填 材の髙充填に適しており、好ましい。絶縁層2の厚みに ついては特に規定するものでないが、絶縁破壊電圧と熱 抵抗とのバランスを考慮すると20~500µmが好まし いり

【0020】又、絶縁層2を形成する絶縁材料組成物に 使用される無機充填材は、比誘電率の低い物質であると とが必須である。熱伝導率が3.0×10⁻³ cal/cm·sec·*C以 上であり、しかも比誘電率が4.5以下である絶縁材料組 成物を得るためには、酸化ベリリウム、ダイアモンド、 窒化硼素が選択される。経済性または安全性を考慮する と窒化硼素が工業的に最も好適な無機充填材である。 又、これらの1種又は2種以上を含み、目的とする所望 の熱伝導率と比誘電率が得られれば、他のアルミナ等の 無機充填材と併用しても良い。

【0021】とれらの無機充填材の粒子径については、 15μm以下が好ましい。15μmを越えると、樹脂との混 合においてブツが発生し易くなったり、硬化後の絶縁層 【0017】とこで金属板1には、板厚0.5~3.0mm程 20 中にボイドが残留し易くなり、熱伝導率の低下や電気絶 緑性の低下が生じ所望の絶縁材料を得られない。15μm 以下であれば、焼結体の破砕物等も、通常の粉末と同様 に用いることができる。又、粒子形状については、熱伝 導率を向上させるために無機充填材を髙充填することが 望ましく、球に近い形状のものが好ましい。

> 【0022】前記窒化硼素としては、h-BN,P-BN,c-BN,t -BN等いろいろなものが用いられるが、これらを混合し て用いることも可能である。特にh-BNは六方晶系に属し 電気絶縁性が高く、安価に入手できる原料であり好まし い。六方晶窒化硼素の結晶性は、その目安として黒鉛化 度(G I 値)で示される。G I 値は、X線回折による(1 00) (101) (102) 面の回折強度(ビーク面積) より、式(1)で算出したものである。

[0023]

【数1】

時に表面処理剤を添加することによっても可能である。 【0026】窒化硼素の配合割合は、40vo1%以上85vo1% 以下が良いが、好ましくは50vo1%以上70vo1%以下であ 40 る。窒化硼素の配合割合が40vo1%以下では、得られる絶 縁材料組成物の熱伝導率が3.0×10-3ca7/cm·sec·℃に達 しない。一方、85vo1%を越えると、前記の表面処理を施 しても、弾力性のある樹脂混合物が得られず、その硬化 物もボロボロの状態なので、本発明の目的を達し得なく なる。50vo1%以上70vo1%以下の場合に、髙熱伝導率で、 しかも低比誘電率のバランスのとれた絶縁材料組成物を 安定して製造することができる。

【0027】導電箔3については、導体回路用銅箔、複 合箔又は銅、アルミニウム、ニッケル等の金属を2種類

用のものが用いられる。その厚みは、5μmから1mmで ある。又、ワイヤーボンディング特性を付与するために ニッケルメッキ、ニッケルー金メッキを導電箔上に施し てもかまわない。

[0028]

【作用および実施例】以下、実施例について具体的に説 明する。

(実施例1)窒化硼素粉(電気化学工業(株)製、GPS-2) をヘキサメチルジシラザン(東芝シリコーン(株) 製)と混合してシリル化処理をした窒化硼素粉を作製し 10 ながら、トランジスターに100W通電してトランジスタ た。このシリル化処理した窒化硼素粉を無機充填材とし て、ビスフェノールF型エポキシ樹脂に61vo1%充填した 混合物を作製した。この混合物にアミン系硬化剤を加 え、加熱硬化して得た硬化物について、以下に示す熱伝 導率測定と比誘電率測定を行った。次に、前記混合物を 1.5mm厚みのアルミニウム板に塗布して厚さ100μmの 層を形成し、更に、その上に厚さ35μmの銅箔を積層し て加熱することで金属ベース回路基板を作製した。この 回路基板を用いて、以下に示した放電開始電圧測定及び トランジスターの通電時の上昇温度測定を行った。又、 回路基板の絶縁破壊寿命を調べるためにV-t特性の測 定を繰り返し数20個にて実施した。得られた結果を表1 に示す。

【0029】<熱伝導率の測定方法>厚さ2mm×直径1 0mmの円盤形の試験片を用い、レーザーフラッシュ法 熱伝導率測定装置(理学電機工業(株)製「LF/TOM-FA-8510B」) により、A T T レンジ; 20 μ V、サンプリン グレート;1000μ秒、フィルター;100H z で測定し

【0030】<比誘電率の測定方法> JIS C6481に基づ き、測定周波数100k Hz、測定温度25°Cで行った。

【0031】<放電開始電圧の測定方法>作製した金属 ベース基板上に、エッチング法により直径が20mmの円 電極パターンを作製した。ベース金属部とパターン部と の間の放電開始電圧を部分放電測定器(三菱電線工業 (株)、QM-20)で、測定周波数100k H z で測定した。 【0032】<トランジスター上昇温度の測定方法>金 属ベース基板の導電箔をエッチングして10×15mmのパ ッド部を形成し、この上にトランジスター(TO-220) (株) 東芝製) をハンダ付けした。 金属板面側を冷却し 一上面での温度を測定した。

【0033】<V-t特性の測定方法>金属ベース基板 上に、エッチング法によって直径が20mmの円電極バタ ーンを作製し、ベース金属部とパターン部との間にAC 半波2kVの電圧を印加した。測定は試験を促進するた めに125℃の環境下で行った。電圧印加開始から絶縁破 壊に至るまでの時間を測定しワイブルブロット法により 平均寿命を算出した。

【0034】(実施例2~9、比較例1~4)無機充填 20 材として、市販のいろいろな粒度の窒化硼素、ダイアモ ンド、酸化ベリリウム、酸化アルミニウム等を準備し、 表1に示す配合割合で、実施例1と同じ方法で、各種の 絶縁材料組成物の硬化物を作製し、熱伝導率及び比誘電 率を測定した。尚、一部のものでは、表面処理を施さな いものも作製した。更に、前記絶縁材料組成物を用いて 回路基板を作製し、実施例1と同様に、放電開始電圧測 定、トランジスター上昇温度測定及びV- t 特性測定を 行った。結果を実施例1の結果とともに表1に示す。 [0035]

30 【表1】

	Г	Γ	無機充塩材				Γ			Ī		r
,	Мо	樹脂の種類	種類	G166	本記称 本記称 本	充填字	表面处理和	熱伝導率	比賽電率	放電 開始 電圧	平均 破壊 時間	トランラスナー 温度
		-	-	-	μm	vol%	-	×10 ⁻³ cal/oursec⋅°C	•	kV	Hr.	°C
	ı	EX7:/-杯型:科/樹脂	窒化研案	1.4	3.5	61	ヘキサナチルフシラザン	9. 1	4, 2	2.2	>10000	71
	2	EX7x/-6A型はわり樹脂	窒化研集	1.6	3. 5	55	エポトシシリフーン	7.0	4, 1	2.2	>10000	79
	3	ビスフェノー・計型に対り樹脂	窒化硼素	1.4	4.0	50	エポキシシリコーン	4.5	4.0	2.3	>10000	129
	4	『スフェ/-好型エキシ樹脂	蜜化研素	1.5	3.0	45	エギキシシリコーン	3. 0	8.9	2.4	>10000	145
実施	5	ビスフェノーが型エ科・独脂	SITENE	-	1. 2	50	-	9. 0	4.4	2.1	>10000	74
例	6	ピスフェノー好型エ科シ樹脂	数化ペタリウム	-	2,1	65	-	18. 2	4. 5	2.1	>10000	49
	7	ビスフェノーが型エ科が樹脂	窗化硼素	2.0	8.7	72	エポキタシリフーン	16. 5	4. 3	2.2 ·	>10000	55
	В	ピスフェノー・好型エ科シ樹脂	窒化研索	1.8	13. 6	81	ないがっ	31, 1	4.4	2.1	>10000	40
	9	ピスフェノー好型3科>樹脂	室化研集 * +酸化<94%	-	-	74	-	25. 4	4.5	2.1	>10000	44
比較例	1	ピスフェノー研型2年9樹脂	酸化硅素	-	5.0	70	エギキシシリコーン	2. 2	3.7	2.5	>10000	>150
	2	ビスフェノー好型エ科>樹脂	酸化了於二分。	-	14. 6	73	-	8.9	7. 6	1. 2	2100	75
	3	ビスフェ/好型エ科>樹脂	窗化硼素	3.5	3. 5	35	-	1. 3	3.8	2. 2	>10000	>150
	4	ピスフェノー研型ゴギャ樹脂	窒化硅素	-	4.5	58	エギキシシリコーン	4. 9	5.6	1.7	2900	119

*窒化硼聚:酸化ベリリウム=1;1 (体積比)

[0036]

【発明の効果】本発明によれば、熱伝導率が高く、しかも比誘電率が低く電気絶縁性に優れた絶縁材料組成物が得られ、又、放電開始電圧が高く長期信頼性に優れた回路基板及びモジュールを得ることができた。本発明の絶縁材料組成物は熱伝導率が高く、しかも比誘電率が低いので、半導体素子の封止材としても好適である。

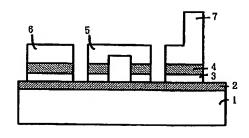
[0037]

【図面の簡単な説明】

*【図1】本発明の金属ベース回路基板を用いたモジュールの断面図である。

- 1. 金属板
- 2. 絶縁層
- 3. 導電箔
- 4. ハンダ
- 5. セラミックスチップ部品
- 6. 半導体素子
- *30 7. 端子

【図1】



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-320538

(43) Date of publication of application: 08.12.1995

(51)Int.CI.

H01B 3/00

B32B 15/08

H05K 1/05

(21)Application number: 06-113046

(71)Applicant: DENKI KAGAKU KOGYO KK

(22)Date of filing:

26.05.1994

(72)Inventor: FUKUDA MAKOTO

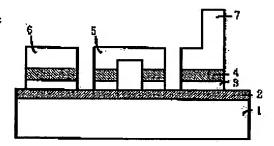
YONEMURA NAOKI UMEZAWA HIROYUKI

(54) INSULATING MATERIAL COMPOSITION AND CIRCUIT BOARD AND MODULE USING THIS INSULATING MATERIAL COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide an insulating material composition for a metal base circuit board, having high heat conductivity and low dielectric constant, further capable of maintaining high electric insulation over a long period, by hardening a mixture composed of inorganic filling material and resin.

CONSTITUTION: By hardening a mixture composed of inorganic filling material and resin, an insulating material composition, having 3.0×10 –3cal/cm.sec, °C or more heat conductivity further with 4.5 or less dielectric constant, is obtained. As the inorganic filling material, containing one kind or more of boron nitride, diamond and beryllium oxide, is preferable, particularly containing hexagonal system boron nitride of 2.0 or less graphitization (GI value) is preferable. The inorganic filling material is preferable high filled, and its shape is preferable a sphere of about 15 μ m or less. In the resin, epoxy resin, silicone resin, etc., are used. This insulating material composition is used, to provide an insulating layer 2 on a metal plate 1 of Al or the like, to laminate conductive foil 3 on this layer, to form a circuit board, further to mount each element 5 to 7, so as to obtain a module.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

29.11.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3465829

[Date of registration] 29.08.2003

[Number of appeal against examiner's decision of

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The insulating material constituent characterized by making it come to harden the mixture which consists of an inorganic filler and resin, for the thermal conductivity being more than 3.0x10-3 cal/cm-sec and **, and moreover specific inductive capacity being 4.5 or less.

[Claim 2] The insulating material constituent according to claim 1 with which an inorganic filler contains one sort in boron nitride, a diamond, and beryllium oxide, or two sorts or more.

[Claim 3] The insulating material constituent according to claim 1 with which an inorganic filler is characterized by a degree of graphitization (GI value) containing 2.0 or less hexagonal boron nitride. [Claim 4] The circuit board which comes to carry out the laminating of the electric conduction foil to a metal plate through an insulating material constituent according to claim 1, 2, or 3. [Claim 5] The module which comes to use the circuit board according to claim 4.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention] [0001]

[Industrial Application] This invention relates to the metal base circuit board using the insulating material constituent and this which are used for electronic parts, such as an electrical machinery and apparatus, a transmitter, and an automotive application, and the module using this further. [0002]

[Description of the Prior Art] High temperature conduction and the insulating material of high withstand voltage are demanded of the application of the electron of the metal base circuit board, a semiconductor device, and others, the sealing agent of an electrical part, adhesives, or a potting agent. For example, since the metal base circuit board is used for the high power field, engine performance, such as high electric insulation and high temperature conductivity, is required of the insulating layer of the substrate. Furthermore, RF-ization of a circuit is progressing for the purpose of the miniaturization of a circuit, and advanced features, and the circuit board with low specific inductive capacity and an insulating material for it are desired. Especially, power components, such as an IGBT component, come to be carried in recent years, with the low dielectric constant, it has high electric insulation, and the metal base circuit board which moreover has high temperature conductivity is required, and the insulating material constituent for forming the insulating layer is needed.

[0003] In the metal base circuit board, although a metal plate and an electric conduction foil are pasted up with the adhesives of electric insulation which consist of resin filled up with the aluminum oxide etc., the insulating material which these adhesives hardened forms the insulating layer on a metal plate. Since many properties of the metal base circuit board are greatly influenced by the property of an insulating layer, therefore an insulating material, various constituents have been indicated.

[0004] For example, it having been high-filled up with the inorganic filler and the insulating adhesives constituent for the circuit boards with high thermal conductivity having been obtained, and having carried out the laminating of a metal substrate and the electric conduction foil through the adhesives constituent, and having obtained the circuit board is indicated by JP,2-286768,A by using the inorganic filler of specific particle diameter.

[0005] Moreover, the bisphenol A mold epoxy resin of 90% or more of purity is filled up with an aluminum oxide, aluminium nitride, and the inorganic filler of boron nitride, and the circuit board using the insulating material and it whose thermal conductivity is 5.0x10-3 - 18.0x10-3 cal/cm-sec and ** and whose glass transition temperature is 164-240 degrees C is indicated by JP,6-44824,A.

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, in the insulating material which consists of resin high-filled up with matter of high specific inductive capacity like an aluminum oxide (specific inductive capacity 9.0), the specific inductive capacity of an insulating material becomes high as the fill of an inorganic filler increases. Moreover, since viscosity became high at this and coincidence and the contamination of a void increased, there was a problem that electric insulation fell and a withstand voltage property fell.

[0007] Since the high voltage is impressed to a void so that the specific inductive capacity of an insulating material is high, the electrical potential difference generally built over the void which exists in a layer-like insulating material becomes easy to discharge by the void. For this reason, the electric insulation of the circuit board using an insulating layer, therefore this tends to fall, so that the specific inductive capacity of a filler is high.

[0008] Moreover, it is known that electric insulation will deteriorate gradually under the service condition, and the circuit board will finally result a dielectric-breakdown phenomenon in a lifting life. a discharge

phenomenon with how partial inside insulating layers, such as a void, at that initial stage depending on which degradation of electric insulation progresses -- presenting -- this partial discharge -- degradation of an insulating layer -- promoting -- just -- being alike -- the discharge phenomenon of passing an insulating layer is caused and it results in dielectric breakdown. Therefore, in order to attain the long-term dependability of electric insulation, it is important to make breakdown voltage high.

[0009] In the conventional metal base circuit board, high temperature conductivity was thought as important and the aluminum oxide with specific inductive capacity high as an inorganic filler was mainly used. Or even if it thought electric insulation as important, and it did not add an inorganic filler or it added, it had limited to restoration of a little chisel. Although the former had high temperature conductivity, electric insulation is low, ***** dependability was inferior in it, and by the latter, although excelled in electric insulation, since thermal conductivity was inferior, it was not able to be used for the application of which high heat dissipation nature is required. Thus, having dependability high electric insulation and over a long period of time [its] had the problem of being difficult, maintaining high temperature conductivity.

[0010] The purpose of this invention is to offer the insulating material constituent used for the metal base circuit board which is high temperature conductivity and can maintain high electric insulation over a long period of time.

[0011] Moreover, even if this invention carries the component of high power by high density, it aims at excelling in heat leakage nature, excelling in electric insulation, and offering the reliable circuit board and a reliable module.

[0012]

[Means for Solving the Problem] This invention is an insulating material constituent characterized by making it come to harden the mixture which consists of an inorganic filler and resin, for the thermal conductivity being more than 3.0x10-3 cal/cm-sec and **, and moreover specific inductive capacity being 4.5 or less.

[0013] Moreover, this invention is an insulating material constituent characterized by this inorganic filler containing one sort in boron nitride, a diamond, and beryllium oxide, or two sorts or more.

[0014] Moreover, this invention is an insulating material constituent with which this inorganic filler is characterized by a degree of graphitization (GI value) containing 2.0 or less hexagonal boron nitride. [0015] Furthermore, this invention is the circuit board which comes to carry out the laminating of the electric conduction foil through the insulating material constituent whose thermal conductivity is more than 3.0x10-3 cal/cm-sec and **, and whose specific inductive capacity is moreover 4.5 or less, in addition is a module which comes to use this circuit board.

[0016] Hereafter, a drawing explains this invention to a detail. The sectional view of the module using the metal base circuit board which comes to form an insulating layer with the insulating material constituent of this invention is shown in <u>drawing 1</u>. After obtaining the metal base circuit board by which the laminating of the electric conduction foil 3 was carried out on the metal plate 1 through the insulating layer 2 which consists of an insulating material constituent of this invention, etching etc. was processed and it is made of the configuration which carried out the laminating of the ceramic chip 5, a semiconductor device 6, and the terminal 7 grade through the pewter 4.

[0017] The aluminum and an aluminium alloy, copper, iron, a stainless steel system alloy, the Invar system multilevel metal, etc. of about 0.5-3.0mm of board thickness are used for a metal plate 1 here. [0018] An insulating layer 2 is the insulating material constituent which mixes and stiffened an inorganic filler and resin, and, moreover, thermal conductivity is [specific inductive capacity] 4.5 or less 3.0x10-3 cal/cm-sec and above **. If the specific inductive capacity of an insulating layer 2 exceeds 4.5, breakdown

voltage will fall extremely, it will become easy to produce discharge degradation, and the long-term dependability of the electric insulation of the circuit board will be spoiled remarkably. About thermal conductivity, the heat generated from a power component as they are under 3.0x10-3 cal/cm-sec and ** cannot be emitted efficiently, but the temperature of a component exceeds junction temperature (about 150 degrees C), a component malfunctions or a life becomes short.

[0019] As resin used for the insulating material constituent which forms an insulating layer 2, an epoxy resin, silicone resin, BT resin, polyimide resin, etc. are used. As an epoxy resin, it is hypoviscosity, and the bisphenol A mold epoxy resin and the bisphenol female mold epoxy resin fit high restoration of an inorganic filler, and are desirable. Although especially the thickness of an insulating layer 2 is not specified, when the balance of a breakdown voltage and thermal resistance is taken into consideration, 20-500 micrometers is desirable.

[0020] Moreover, as for the inorganic filler used for the insulating material constituent which forms an

insulating layer 2, it is indispensable that it is the matter with low specific inductive capacity. Thermal conductivity is more than 3.0×10^{-3} cal/cm-sec and **, and in order to obtain the insulating material constituent whose specific inductive capacity is moreover 4.5 or less, beryllium oxide, a diamond, and boron nitride are chosen. When economical efficiency or safety is taken into consideration, boron nitride is the industrial most suitable inorganic filler. Moreover, as long as the thermal conductivity and specific inductive capacity of the request made into the purpose are obtained including these one sort or two sorts or more, you may use together with inorganic fillers, such as other aluminas.

[0021] About the particle diameter of these inorganic fillers, 15 micrometers or less are desirable. If 15 micrometers is exceeded, it becomes, or into the insulating layer after hardening, a void tends to remain, and comes [BUTSU] being easy to generate in mixing with resin, decline in thermal conductivity and the fall of electric insulation arise, and a desired insulating material cannot be obtained. If it is 15 micrometers or less, the debris of a sintered compact etc. can be used like the usual powder. Moreover, about particle shape, in order to raise thermal conductivity, it is desirable to be high-filled up with an inorganic filler, and the thing of the configuration near a ball is desirable.

[0022] As said boron nitride, although various things, such as h-BN, P-BN, c-BN, and t-BN, are used, it is also possible to mix and use these. It belongs to hexagonal system, and electric insulation is high and it is [especially h-BN is the raw material which can come to hand cheaply, and] desirable. The crystallinity of hexagonal boron nitride is shown by the degree of graphitization (GI value) as the standard. GI value is computed by the formula (1) from the diffraction reinforcement (peak area) of the field by the X diffraction (100) (101) (102).

[0023]

[Equation 1]

GI value = (100) (area + (101) area)/(102) (area) (1)

[0024] Crystallinity is so high that GI value is small. GI value is set to 1.4 by the hexagonal boron nitride to which crystallization progressed completely. Although 2.0 or less are desirable as for the crystallinity of the hexagonal boron nitride used by this invention, it is 1.6 or less more preferably. Generally the hexagonal boron nitride to which a degree of graphitization exceeds 2.0 has low purity, gas is generated at the time of mixing with resin, and the problem that thermal conductivity is low occurs low [electric insulation-proof] that it is easy to involve in a void.

[0025] In order to raise the adhesive property of the interface of resin and boron nitride, as for the aforementioned boron nitride, what performed surface treatment with the silicone coupling agent, the titanate coupling agent, the sililation reagent, etc. is good. What performed surface treatment with the organic silane compound among these is more desirable. Moreover, the surface treatment of the boron nitride by the finishing agent is possible also by adding a finishing agent at the time of mixing of resin and boron nitride.

[0026] Although less than [more than 40vol%85vol%] is good as for the blending ratio of coal of boron nitride, it is less than [more than 50vol%70vol%] preferably. The thermal conductivity of the insulating material constituent with which the blending ratio of coal of boron nitride is obtained less than [40vol%] does not reach 3.0x10-3 cal/cm-sec and **. Elastic resin mixture is not obtained, but since the hardened material is also in the condition of BOROBORO, it may stop on the other hand, attaining the purpose of this invention, even if it performs the aforementioned surface preparation when 85vol% is exceeded. In the case of not more than more than 50vol%70vol%, it is high temperature conductivity, and the insulating material constituent which was moreover able to balance low specific inductive capacity can be stabilized and manufactured.

[0027] the electric conduction foil 3 -- a conductor -- general-purpose things, such as a clad foil which used the alloy containing two or more kinds of metals, such as copper foil for circuits, a compound foil or copper, aluminum, and nickel, or said metal, are used. The thickness is 1mm from 5 micrometers. Moreover, in order to give a wire-bonding property, nickel plating and nickel-gold plate may be performed on an electric conduction foil.

[0028]

[Function and Example(s)] Hereafter, an example is explained concretely.

(Example 1) The boron nitride powder which mixed boron nitride powder (the DENKI KAGAKU KOGYO K.K. make, GPS-2) with hexamethyldisilazane (Toshiba Silicone make), and carried out silanizing processing was produced. this boron nitride powder that carried out silanizing processing -- an inorganic filler -- carrying out -- a bisphenol female mold epoxy resin -- 61vol(s)% -- the filled mixture was produced. The thermal conductimetry and specific-inductive-capacity measurement which are shown below were

performed about the hardened material which added and carried out heat hardening of the amine system curing agent to this mixture, and obtained it into it. Next, said mixture was applied to the aluminum plate of 1.5mm thickness, the layer with a thickness of 100 micrometers was formed, and the metal base circuit board was further produced by carrying out the laminating of the copper foil with a thickness of 35 micrometers, and heating it on it. The breakdown voltage measurement shown below and the rise thermometry at the time of energization of a transistor were performed using this circuit board. Moreover, in order to investigate the dielectric-breakdown life of the circuit board, measurement of a V-t property was repeated and it carried out by 20 numbers. The obtained result is shown in Table 1.

[0029] It measured by filter;100Hz ATT range;20microvolt and sampling rate;1000 microsecond using the test piece of a disk form with a 2mm[in <measuring method of thermal conductivity> thickness] x diameter of 10mm by laser flash method thermal conductivity measuring apparatus ("LF/TCM-FA-8510B" by Rigaku Industrial Corp.).

[0030] Based on the <measuring method of specific inductive capacity> JIS C 6481, it carried out at the test frequency of 100kHz, and the measurement temperature of 25 degrees C.

[0031] On the metal base substrate of which <measuring method of breakdown voltage> production was done, the diameter produced the circle electrode pattern which is 20mm by the etching method. The breakdown voltage between the base metal section and the pattern section was measured by 100kHz of test frequencies with the partial discharge measuring instrument (Mitsubishi Cable Industries, Ltd., QM-20). [0032] The electric conduction foil of a <measuring method of transistor rise temperature> metal base substrate was etched, the 10x15mm pad section was formed, and the transistor (TO-220, Toshiba Make) was soldered on this. Cooling a metal plate surface side, it energized 100W to the transistor and the temperature on the top face of a transistor was measured.

[0033] On the <measuring method of V-t property> metal base substrate, by the etching method, the circle electrode pattern whose diameter is 20mm was produced, and the electrical potential difference of 2kV of AC half waves was impressed between the base metal section and the pattern section. Measurement was performed under the 125-degree C environment, in order to promote a trial. Time amount until it results [from electrical-potential-difference impression initiation] in dielectric breakdown was measured, and average life was computed by the Weibull plotting method.

[0034] (Examples 2-9, examples 1-4 of a comparison) As an inorganic filler, the boron nitride of commercial various grain size, a diamond, beryllium oxide, an aluminum oxide, etc. were prepared, by the blending ratio of coal shown in Table 1, by the same approach as an example 1, the hardened material of various kinds of insulating material constituents was produced, and thermal conductivity and specific inductive capacity were measured. In addition, what does not perform surface treatment was produced in some things. Furthermore, the circuit board was produced using said insulating material constituent, and breakdown voltage measurement, a transistor rise thermometry, and V-t property measurement were performed like the example 1. A result is shown in Table 1 with the result of an example 1. [0035]

[Table 1]

N		樹脂の種類	無機充塡材				atraction tracked	**		故電	平均	トランタスター
	No		種類	CI値	平均拉径	充填率	表面処理剤	熱伝導率	比誘電率	開始 電圧	破地 時間	温度
		•	-	-	μm	vol%	-	×10 ⁻³ cal/om·sec·℃	-	kV	Hr.	3
实施例	1	『スフェノーが型ュキキシ樹脂	窒化研弄	1.4	3.5	61	ヘキサノチルジシラザン	9. 1	4. 2	2.2	>10000	71
	2	Eスフェ/ールA型エキトン樹脂	窒化硬素	1.6	3. 5	55	エポキシシリコーン	7. 0	4.1	2. 2	>10000	79
	3	ピスフェノーが型エキャを機能	空化研索	1. 4	4.0	50	エポキシシリコーン	4. 5	4.0	2. 3	>10000	129
	4	ビスフェノー研型1科/樹脂	蜜化硼素	1.5	3.0	45	エポキシシリコーン	3. 0	3. 9	2.4	>10000	145
	5	ピスフェノー6F型エキシ樹脂	ダイブモンド	-	1. 2	50	•	9. 0	4.4	2.1	>10000	74
	6	ゼスフェノー研型エキシ樹脂	酸化ベリリウム	1	2.1	6 5	-	18. 2	4. 5	2.1	>10000	49
	7	ピスフェノー・好型エ科ジ樹脂	窗化硼素	2.0	8.7	72	エポキケシリコーン	16. 5	4.3	2. 2 ·	>10000	55
	В	ピスフェノー好型エ科ジ樹脂	盛化硼菜	1. 8	13. 6	81	ないがつ	31. 1	4.4	2.1	>10000	40
	9	ビスフェノー好型エ科ジ樹脂	窒化研業 キ +酸化パリリウム	-	-	74	-	25. 4	4. 5	2. 1	>10000	44
比較例	1	ピスフェノー研型エキャ樹脂	酸化硅業	-	5.0	70	エギキシシリコーン	2.2	3.7	2. 5	>10000	>150
	2	ピスフェノー好型エ科/樹脂	敗化するミニウム	-	14. 6	73	-	8.9	7. 6	1. 2	2100	75
	3	ピスフェノー・好型は科ジ樹脂	蜜化硼素	3.5	3. 5	. 35	•	1. 3	3. 8	2. 2	>10000	>150
	4	ビスフェノー・F型コキシ樹脂	窒化硅素	-	4. 5	58	エギキシシリコーン	4. 9	5. 6	1.7	2900	119

*窒化硼栗:酸化ベリリウム=1;1(体強比)

[0036]

[Effect of the Invention] According to this invention, the circuit board and the module thermal conductivity was high, and the insulating material constituent specific inductive capacity moreover excelled [constituent] in electric insulation low was obtained, and breakdown voltage excelled [module] in dependability highly over a long period of time were able to be obtained. The insulating material constituent of this invention has high thermal conductivity, and since specific inductive capacity is moreover low, it is suitable also as a sealing agent of a semiconductor device.

[0037]

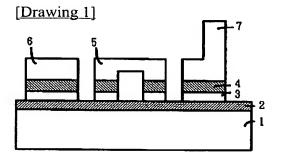
[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DRAWINGS



[Translation done.]

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Def	fects in the images include but are not limited to the items checked:
C	☐ BLACK BORDERS
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	☐ FADED TEXT OR DRAWING
ξ	☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
	COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	GRAY SCALE DOCUMENTS
	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: _

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.